

國立交通大學

電子物理系

碩士論文

光學掃描矽晶片背面之積體電路成像

Optical Scanning Technique Applied to the
Backside Imaging of Silicon ICs



研究生：龔俊穎

指導教授：謝太炯 教授

中華民國九十四年六月

光學掃瞄矽晶片背面之積體電路成像

Optical Scanning Technique Applied to the Backside Imaging of Silicon ICs

研究生：龔俊穎

Student：Jiun-Ying Gung

指導教授：謝太炯 教授

Adivsor：Prof. Tai-Chiung Hsieh

國立交通大學



A thesis

Submitted to Institute and Department of Electrophysics

College of Science

National Chiao-Tung University

in partial fulfillment of the Requirements

for the degree of

Master

In Electrophysics

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年六月